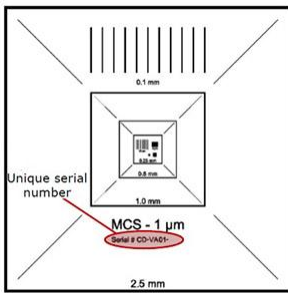


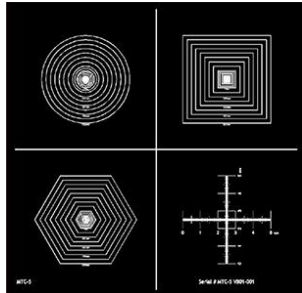
顕微鏡キャリブレーション、テストおよび標準サンプル一覧

キャリブレーション標準サンプルは、顕微鏡およびX線分析装置を校正するための不可欠なツールです。校正された装置だけが正確なデータを生成します。この一覧では、SEM、FIB-SEM、TEM、EDS/WDS、LM およびデジタルイメージングシステムで使用可能なキャリブレーション標準サンプルを紹介しています。これらの汎用性の高い、正確で手頃な価格のキャリブレーション標準サンプルは、お持ちの装置の最適な校正に最適なサンプルです。

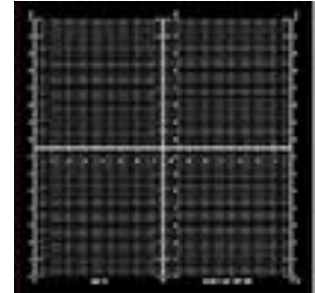
SEM - FIB - FESEM - Table top SEM



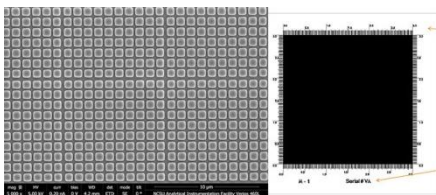
MCS-1&MC'S-0.1 トレーサブル、認定用高倍率の校正標準サンプル



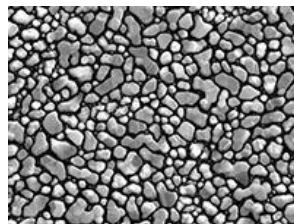
MTC-5 メディア&低倍率校正のための複数のトレーサブルなターゲット



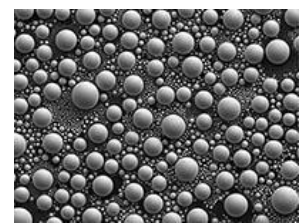
LAMC-15 トレーサブルな低倍率/大面積の校正標準



M-1&M-10
1 μm と 10 μm ピッチの
トレーサブルなグリッドパターン

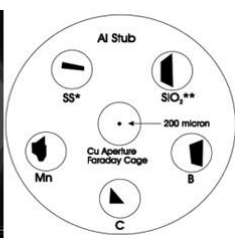
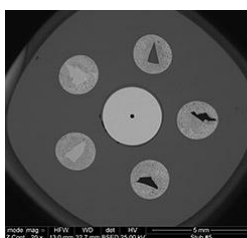


カーボン膜上の面分解能
テスト用 Au アイランド



カーボン膜上の面分解能
テスト用 Sn アイランド

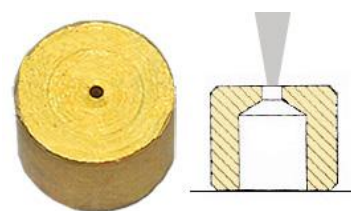
SEM / EDS / WDS



EDS/WDS 用コンパクトな
較正標準サンプル

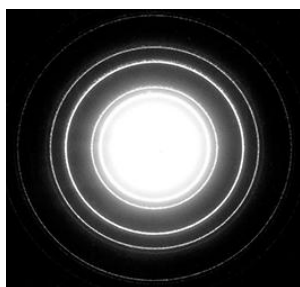


EDS/WDS 用定量分析
参照標準サンプル

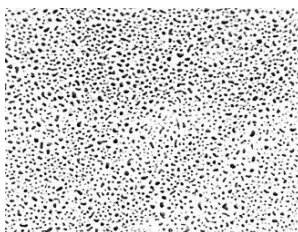


ビーム電流測定用
ファラデーカップ

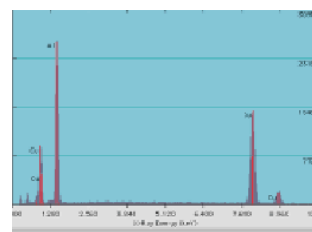
TEM - TEM / EDS



TEM 分解能標準サンプル

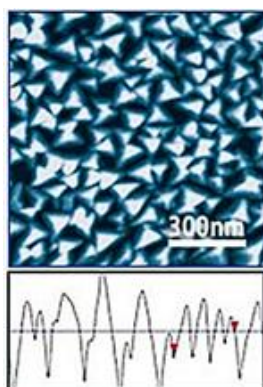


TEM テスト標準サンプル

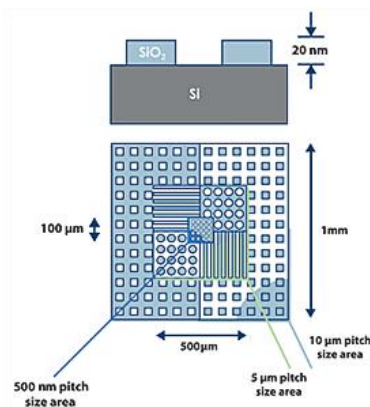


TEM・EDS 較正標準サンプル

AFM-SPM

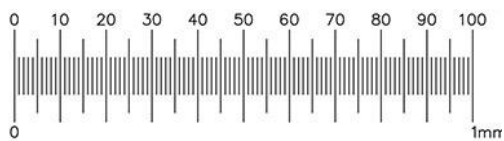


AFM Tip チェック用サンプル

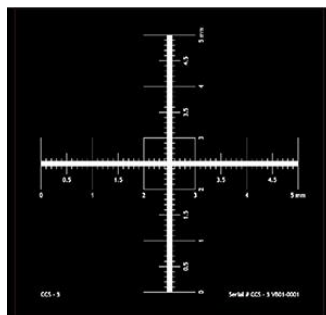


AFM XYZ 標準サンプル

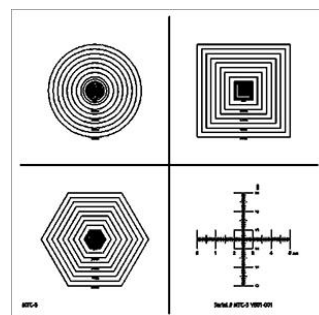
LM - Digital Imaging



ガラスステージ μm 目盛
リニア、断面、組成物の認証



シリコンベースの目盛。 トレーサ
ブルなリニア、断面、組成物の認証



MTC-5 複数のトレーサブル
なターゲット校正標準
サンプル

備考：個々のサンプルの詳細に関しましては別途お問合せ下さい。
本内容および価格は予告なしに変更されることがございます。

 **エルミネット株式会社**

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4
TEL:03-6379-4105 FAX:03-6379-4106
www.elminet.co.jp CN: Standard 一覧 1610A